

(19) 日本国特許庁(JP)

再公表特許(A1)

(11) 国際公開番号

WO2009/131027

発行日 平成23年8月18日 (2011.8.18)

(43) 国際公開日 平成21年10月29日 (2009.10.29)

(51) Int.Cl.

A 6 1 B 8/08 (2006.01)

F 1

A 6 1 B 8/08

テーマコード (参考)

4 C 6 O 1

		審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 25 頁)
(出願番号)	特願2010-509143 (P2010-509143)	
(21)国際出願番号	PCT/JP2009/057469	
(22)国際出願日	平成21年4月14日 (2009.4.14)	
(31)優先権主張番号	特願2008-114869 (P2008-114869)	
(32)優先日	平成20年4月25日 (2008.4.25)	
(33)優先権主張国	日本国 (JP)	
		(71) 出願人 000153498 株式会社日立メディコ 東京都千代田区外神田四丁目14番1号
		(72) 発明者 松村 剛 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 株式会社日立メディコ内
		F ターム (参考) 4C601 BB02 DD19 DD23 GC03 GC04 HH29 JB36 JB48 KK07 KK12 KK34

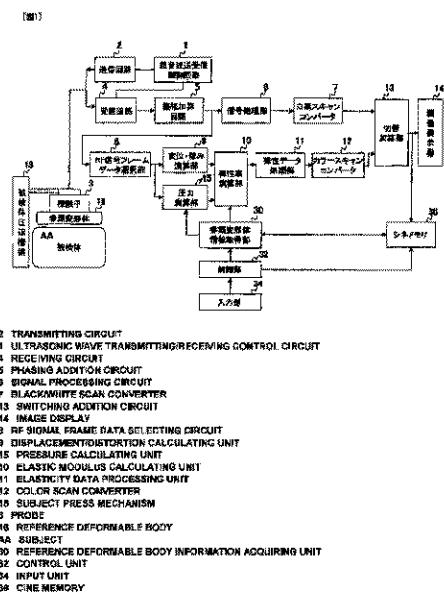
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 参照変形体、超音波診断装置及び超音波診断方法

(57) 【要約】

種類を特定できる参照変形体、参照変形体の種類を特定する超音波診断装置及び超音波診断方法を提供する。

参照変形体16が超音波送受信面に装着された超音波探触子3と、参照変形体16を介して被検体に超音波を送受信し、被検体の断層部位のRF信号フレームデータに基づいて断層画像を生成する断層画像構成部6,7と、断層画像を表示する表示部14とを備えた超音波診断装置において、参照変形体16に付与されたIDと参照変形体16の種類との関係を記憶する記憶部52と、超音波探触子3に装着された参照変形体16のIDに対応する参照変形体16の種類を記憶部52から読み出し、参照変形体の種類を特定する種類特定部54とを備えることを特徴とする超音波診断装置。



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

参照変形体が超音波送受信面に装着された超音波探触子と、前記参照変形体を介して被検体に超音波を送受信し、前記被検体の断層部位のRF信号フレームデータに基づいて断層画像を生成する断層画像構成部と、前記断層画像を表示する表示部とを備えた超音波診断装置において、

前記参照変形体に付与されたIDと前記参照変形体の種類との関係を記憶する記憶部と、前記超音波探触子に装着された前記参照変形体のIDに対応する前記参照変形体の種類を前記記憶部から読み出し、前記参照変形体の種類を特定する種類特定部とを備えることを特徴とする超音波診断装置。

10

【請求項 2】

前記参照変形体の種類は、前記参照変形体の厚さ、弾性率を含む弾性特性、音響特性、散乱体濃度、装着される前記超音波探触子のうち少なくとも1つを含んでいることを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。

【請求項 3】

前記表示部は、前記種類特定部で特定された前記参照変形体のID又は前記参照変形体の種類の少なくとも1つを表示することを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。

【請求項 4】

前記参照変形体又はそのパッケージの少なくとも1つに前記IDが付与されていることを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。

20

【請求項 5】

前記参照変形体の種類のうち厚さと弾性率の情報を前記種類特定部から読み出し、前記参照変形体に掛かる圧力を演算する圧力演算部と、前記RF信号フレームデータに基づいて前記断層部位における組織の歪みを演算する歪み演算部と、演算された圧力及び歪みに基づいて前記組織の弾性率を演算する弾性率演算部とを備えることを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。

【請求項 6】

前記圧力演算部は、前記参照変形体の前記厚さとその変位から求められる歪み及び前記弾性率に基づいて、前記参照変形体に掛かる圧力を演算することを特徴とする請求項記載の超音波診断装置。

30

【請求項 7】

前記弾性率演算部によって演算された前記組織の弾性率に基づいて弾性画像を生成する弾性画像構成部を備えることを特徴とする請求項5記載の超音波診断装置。

【請求項 8】

前記断層画像における前記参照変形体の特徴量を解析する画像解析部を備え、前記記憶部は、解析された前記参照変形体の特徴量と前記参照変形体の種類との関係を記憶し、前記種類特定部は、新たに得られる前記断層画像における前記参照変形体の特徴量に対応する前記参照変形体の種類を前記記憶部から読み出し、前記参照変形体の種類を特定することを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。

【請求項 9】

前記特徴量は、前記断層画像のエコー輝度の平均値であり、前記種類特定部は、新たに得られる前記断層画像のエコー輝度の平均値に基づいて前記参照変形体の種類を特定することを特徴とする請求項8記載の超音波診断装置。

40

【請求項 10】

前記特徴量は、前記前記参照変形体に含まれる散乱体のエコー輝度であり、前記種類特定部は、新たに得られる前記断層画像における前記散乱体のパターン又は大きさ又は形状に基づいて前記参照変形体の種類を特定することを特徴とする請求項8記載の超音波診断装置。

【請求項 11】

前記特徴量は、前記参照変形体の形状又は前記参照変形体に含まれる特徴物であり、前

50

記種類特定部は、新たに得られる前記断層画像における前記参照変形体の形状又は特徴物に基づいて前記参照変形体の種類を特定することを特徴とする請求項8記載の超音波診断装置。

【請求項 1 2】

前記種類特定部で特定された前記参照変形体の厚さに応じて、断層画像又は弾性画像を前記超音波探触子側にシフトする画像処理部を備えることを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。

【請求項 1 3】

前記種類特定部で特定された前記参照変形体の厚さに応じて、前記参照変形体に超音波がフォーカスされないように、前記超音波のフォーカスを制御する超音波送受信制御部を備えることを特徴とする請求項1記載の超音波診断装置。

10

【請求項 1 4】

参照変形体が超音波送受信面に装着された超音波探触子と、前記参照変形体を介して被検体に超音波を送受信し、前記被検体の断層部位のRF信号フレームデータに基づいて断層画像を生成する断層画像構成部と、前記断層画像を表示する表示部とを備えた超音波診断装置を用いた超音波診断方法において、

前記参照変形体に付与されたIDと前記参照変形体の種類との関係を記憶するステップと、前記超音波探触子に装着された前記参照変形体のIDに対応する前記参照変形体の種類を前記記憶部から読み出すステップと、前記参照変形体の種類を特定するステップとを含むことを特徴とする超音波診断方法。

20

【請求項 1 5】

超音波探触子の超音波送受信面に装着され、厚さ、弾性率を含む弾性特性、音響特性、散乱体特性の少なくとも1つに対応するIDが付与されたことを特徴とする参照変形体。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0 0 0 1】

本発明は、超音波探触子の超音波送受信面に装着される参照変形体と、超音波を利用して被検体内の撮像対象部位について断層画像、又は生体組織の硬さまたは軟らかさを示す弾性画像を表示する超音波診断装置及び超音波診断方法に関する。

【背景技術】

30

【0 0 0 2】

超音波診断装置は、超音波探触子により被検体内部に超音波を送信し、被検体内部から生体組織の構造に応じた超音波の反射エコー信号を受信し、例えばBモード像等の断層画像を構成して診断用に表示する。

【0 0 0 3】

近年の超音波診断装置は、手動又は機械的な方法により超音波探触子で被検体を圧迫して超音波受信信号を計測して、組織の変位を求め、その変位データに基づいて生体組織の弾性を表す弾性画像を表示している。この時、超音波探触子に参照変形体を固定具を介して装着し、超音波送受信により得られるRF信号フレームデータから被検体と参照変形体の境界を検出して、その境界の位置情報から被検体を圧迫する圧力を計測することが開示されている。(例えば、特許文献1)

40

【先行技術文献】

【特許文献】

【0 0 0 4】

【特許文献 1】国際公開WO2005/120358号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0 0 0 5】

超音波探触子に装着する参照変形体は、様々な種類がある。例えば、超音波探触子の大きさや形状が異なれば、その超音波探触子に最適な参照変形体の大きさや形状が異なる。

50

リニア型の超音波探触子では、直線状の参照変形体が装着される。コンベックス型の超音波探触子では、曲線状の参照変形体が装着される。また、計測部位の深度又は大きさ、被検体の体型が異なれば、参照変形体の硬さや厚さが異なる。このように、計測状況に応じて最適な特性を持つ参照変形体に切り替える必要がある。

【0006】

しかしながら、参照変形体の種類が特定されないと、弾性率演算や超音波送受信の設定などを適切に行なうことができない。

本発明では、超音波探触子に装着する参照変形体の種類を特定することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

本発明の課題を解決するため、参照変形体が超音波送受信面に装着された超音波探触子と、前記参照変形体を介して被検体に超音波を送受信し、前記被検体の断層部位のRF信号フレームデータに基づいて断層画像を生成する断層画像構成部と、前記断層画像を表示する表示部とを備えた超音波診断装置において、前記参照変形体に付与されたIDと前記参照変形体の種類との関係を記憶する記憶部と、前記超音波探触子に装着された前記参照変形体のIDに対応する前記参照変形体の種類を前記記憶部から読み出し、前記参照変形体の種類を特定する種類特定部とを備える。よって、参照変形体の種類を特定することができる。

10

【0008】

また、前記断層画像における前記参照変形体の特徴量を解析する画像解析部を備え、前記記憶部は、解析された前記参照変形体の特徴量と前記参照変形体の種類との関係を記憶し、前記種類特定部は、新たに得られる前記断層画像における前記参照変形体の特徴量に対応する前記参照変形体の種類を前記記憶部から読み出し、前記参照変形体の種類を特定する。よって、参照変形体の種類を特定することができる。

20

【0009】

さらに、前記種類特定手段で特定された前記参照変形体の厚さに応じて、断層画像又は弾性画像を前記超音波探触子側にシフトする画像処理部を備える。さらに、前記種類特定手段で特定された前記参照変形体の厚さに応じて、前記参照変形体に超音波がフォーカスされないように、前記超音波のフォーカスを制御する超音波送受信制御部を備える。

30

【発明の効果】

【0010】

本発明では、参照変形体の種類を認識し、その情報を弾性演算に反映させたり、表示したりすることができる。

【図面の簡単な説明】

【0011】

【図1】本発明の全体構成を示す図。

40

【図2】本発明の参照変形体の装着形態を示す図。

【図3】本発明の、IDの表示形態を示す図。

【図4】本発明の第1の実施形態を示す図。

【図5】本発明の圧力計測の実施形態を示す図。

【図6】本発明の第2の実施形態を示す図。

【図7】本発明の散乱体が含有された参照変形体の断層画像を示す図。

【図8】本発明の異なる複数の層からなる参照変形体の断層画像を示す図。

【図9】本発明のバーコードを有した参照変形体の断層画像を示す図。

【図10】本発明の第3の実施形態を示す図。

【図11】本発明の補正前、補正後の断層画像を示す図。

【符号の説明】

【0012】

1 超音波送受信制御回路、2 送信回路、3 超音波探触子、4 受信回路、5 整相加算回路、6 信号処理部、7 白黒スキャンコンバータ、8 RF信号フレームデータ選択部

50

、9 変位・歪み演算部、10 弹性率演算部、11 弹性データ処理部、12 カラースキャンコンバータ、13 切替加算部、14 画像表示器、15 圧力演算部、16 参照変形体、30 参照変形体情報取得部、32 制御部、34 入力部、36 シネメモリ

【発明を実施するための形態】

【0013】

本発明の実施形態を図面に基づいて説明する。図1は、本発明による超音波診断装置を示すブロック図である。超音波診断装置は、超音波を利用して被検体の計測部位について断層画像を得るとともに生体組織の硬さ又は軟らかさを表す弾性画像を表示するものである。

【0014】

超音波診断装置は、図1に示すように、超音波送受信制御回路1と、送信回路2と、超音波探触子3と、受信回路4と、整相加算回路5と、信号処理部6と、白黒スキャンコンバータ7と、RF信号フレームデータ選択部8と、変位・歪み演算部9と、弾性率演算部10と、弾性データ処理部11と、カラースキャンコンバータ12と、切替加算部13と、画像表示器14と、圧力演算部15と、参照変形体16と、参照変形体情報取得部30と、制御部32、入力部34と、シネメモリ36を具備して構成されている。

【0015】

超音波探触子3は、多数の振動子を短冊状に配列して形成されたものであり、機械式または電子的にビーム走査を行って被検体に超音波を送信及び受信するものである。各振動子は、一般に、入力されるパルス波、または連続波の送波信号を超音波に変換して発射する機能と、被検体の内部から発射する反射エコーを電気信号(反射エコー信号)に変換して出力する機能を有している。

【0016】

超音波探触子3の超音波送受信面に参照変形体16が装着されている。参照変形体16を被検体の体表に接触させ、被検体を圧迫する。圧迫動作は、超音波探触子3で超音波送受信を行なうとともに被検体を圧迫して体腔内の計測部位に応力分布を与える。

【0017】

超音波送受信制御回路1は、超音波を送信及び受信するタイミングやフォーカスを制御するものである。送信回路2は、超音波探触子3を駆動して超音波を発生させるための送波パルスを生成するとともに、内蔵された送波整相加算回路によって送信される超音波の収束点(フォーカス)をある深さに設定するものである。受信回路4は、超音波探触子3で受信した反射エコー信号を所定のゲインで増幅するものである。増幅された各振動子の数に対応した数の反射エコー信号が整相加算回路5に入力される。整相加算回路5は、受信回路4で増幅された反射エコー信号の位相を制御し、RF信号フレームデータを形成するものである。

【0018】

整相加算回路5の一方の出力側には、信号処理部6と白黒スキャンコンバータ7が備えられている。信号処理部6は、整相加算回路5からのRF信号フレームデータを入力して、ゲイン補正、ログ補正、検波、輪郭強調、フィルタ処理等の各種信号処理を行なうものである。

【0019】

白黒スキャンコンバータ7は、信号処理部6で信号処理されたRF信号フレームデータを所定の周期で取得する。そして、白黒スキャンコンバータ7は、RF信号フレームデータに基づく断層画像データをテレビジョン方式の周期で読み出す。

【0020】

また、整相加算回路5の他方の出力側には、RF信号フレームデータ選択部8と、変位・歪み演算部9と、圧力演算部15と、弾性率演算部10が備えられている。また、弾性率演算部10の後段には、弾性データ処理部11とカラースキャンコンバータ12が備えられている。

【0021】

そして、白黒スキャンコンバータ7とカラースキャンコンバータ12との出力側には切替

10

20

30

40

50

加算部13が備えられている。画像表示器14は、白黒スキャンコンバータ7によって得られた断層画像データに基づく断層画像とカラースキャンコンバータによって得られた弹性画像データに基づく弹性画像を表示するモニタである。切替加算部13の出力側にあるシネメモリ36は、断層画像データと弹性画像データを時間情報とともに記憶するものである。シネメモリ36に記憶された断層画像データと弹性画像データは、入力部34からの指示により画像表示器14に表示される。

【0022】

RF信号フレームデータ選択部8は、整相加算回路5から出力されるRF信号フレームデータをRF信号フレームデータ選択部8内に備えられたフレームメモリ内に順次確保し(現在確保されたRF信号フレームデータをRF信号フレームデータNとする。)、時間的に過去のRF信号フレームデータN1、N2、N3…NMの中から1つのRF信号フレームデータを選択し(RF信号フレームデータXとする。)、変位・歪み演算部9に1組のRF信号フレームデータNとRF信号フレームデータXを出力する役割を担うものである。整相加算回路5から出力される信号をRF信号フレームデータと記述したが、RF信号を複素復調したI, Q信号の形式になった信号であってもよい。

10

【0023】

変位・歪み演算部9は、RF信号フレームデータ選択部8によって選択された1組のRF信号フレームデータに基づいて1次元又は2次元の相關処理を実行し、断層画像上の各計測点の変位又は移動ベクトル(変位の方向と大きさ)を計測し、変位フレームデータを生成し、変位フレームデータから歪みを演算するものである。歪みの演算については、例えば、その変位を空間微分することによって計算上で求めるものとする。この移動ベクトルの検出法としては、例えば、ブロック・マッチング法やグラジェント法がある。ブロック・マッチング法は、画像を例えばN×N画素からなるブロックに分け、現フレーム中の着目しているブロックにもっとも近似しているブロックを前フレームから探索し、これらを参照して符号化を行うものである。

20

【0024】

弹性率演算部10は、変位・歪み演算部9から出力される歪み情報と圧力演算部15から出力される圧力情報から弹性率を演算して、弹性率の数値データ(弹性フレームデータ)を生成し、弹性データ処理部11とカラースキャンコンバータ12に出力するものである。弹性率の内の一つである、例えばヤング率Ymの演算については、以下の式に示すように、各演算点における応力(圧力)を各演算点における歪みで除することにより求める。下記数式において、i, jの指標は、フレームデータの座標を表す。

30

【0025】

【数1】

$$Y_{mi,j} = \text{圧力 (応力)} i, j / (\text{歪み} i, j) \quad (i, j = 1, 2, 3, \dots)$$

ここで、被検体に与えられた圧力は、圧力演算部15にて計測される。圧力演算部15は、参考変形体16に与えられた圧力を演算により求め、被検体に与えられた圧力として出力している。詳細は後述する。

40

【0026】

弹性データ処理部11は、算出された弹性フレームデータに座標変面内におけるスムージング処理、コントラスト最適化処理や、フレーム間における時間軸方向のスムージング処理等の様々な画像処理を行なう。

【0027】

カラースキャンコンバータ12は、弹性データ処理部11から出力される弹性フレームデータに光の3原色、赤(R)、緑(G)、青(B)の色相情報を付与する。例えば、大きい弹性率は赤色コードに変換され、小さい弹性率は青色コードに変換される。

また、被検体圧迫機構18は、モータやワイヤ等により超音波探触子3を上下方向に移動させ、被検体を加圧するものである。なお、操作者が超音波探触子3を上下方向に手動で移動させてよい。

50

【0028】

(第1の実施形態：ID手入力)

ここで、第1の実施形態について図1～5を用いて説明する。第1の実施形態は、操作者がIDを入力して、参照変形体の種類を超音波診断装置に認識させ、その種類を弾性演算に反映させたり、表示したりする形態である。このIDは、参照変形体の種類が同定できる指標となるものである。

【0029】

第1の実施形態では、主に、参照変形体16のIDを入力する入力部34と、入力部34にて入力されたIDを参照変形体情報取得部30に出力させる制御部32と、出力されたIDと対応する参照変形体16の種類を取得し、参照変形体16の種類を圧力演算部15又は弾性率演算部10の演算に反映させる参照変形体情報取得部30とを備えている。10

【0030】

まず、参照変形体16の装着形態を図2を用いて説明する。図2(a)に示すように、固定具17は、中央に空隙を有した枠体20と、枠体20の下面から下方向に伸びる一对の把持部21となる。枠体20と把持部21は一体に成型されている。把持部21には、超音波探触子3の側部の溝に嵌るように突起部(図示しない。)が設けられている。そのため、固定具17を超音波探触子3にワンタッチで嵌め込むことができる。また、枠体20の空隙の内周面には、参照変形体16を保持するための溝部22が設けられている。溝部22の幅は3mm程度であり、溝部22の深さは5mm程度である。

【0031】

図2(b)に示すように、参照変形体16は、四角形状の平板体25上面の中央部に長方体26が設けられた形状である。参照変形体16の長方体26のサイズは、固定具17の空隙から突出することができるサイズである。また、平板体25の厚さは、固定具17の溝部22に収まる3mm程度の厚さである。20

【0032】

参照変形体16は、オイル系のゲル素材やアクリルアミド等の水をベースとしたゲル素材、シリコン等をベースとして生成されたものである。アクリルアミドは、架橋剤(BIS)を触媒の存在下で重合させるとアクリルアミドゲルとして生成される。これは三次元の網目構造をもった高分子ゲルであり、寒天やゼラチンのような触感を持つ。このように、凝固前は溶液であるが、凝固剤を混入して時間が経過するとゲル状に固まる材料が参照変形体16として好適である。粘性の低いアクリルアミド等の素材によって構成されれば、圧迫操作に俊敏に応答するため圧力計測に適する。また、参照変形体16は、例えば水性樹脂ゲル化物をベースにしたような、超音波診断のファントムとして利用される材料であってもよい。30

【0033】

図2(c)には、固定具17に参照変形体16を装着させた形態を示す。枠体20の内周面に形成された溝部22に平板体25の端部が挿入され、参照変形体16が固定具17に装着される。参照変形体16である平板体25は弾性体であるため、その弾性力によって、平板体25を溝部22に嵌め込むことができる。このように、固定具17に参照変形体16を装着させると、参照変形体16の長方体26が固定具17の枠体20から突出した状態になる。40

【0034】

図2(d)には、参照変形体16と固定具17が超音波探触子3に固定された状態の長手方向の断面図を示す。図2(c)のように固定具17に参照変形体16を装着させた状態で、固定具17が把持部21を介して超音波探触子3に固定される。固定具17が超音波探触子3に固定されると、超音波探触子3の上部に設けられた振動子19に参照変形体16が接する状態になる。この状態で参照変形体16の上面に被検体を接触させ、振動子19から超音波の送受信を行なう。

【0035】

また、図3に示すように、参照変形体16又は参照変形体16のパッケージ40は、ID40を有している。

【0036】

50

(1 1 : 参照変形体にID)

具体的には、図3(a)に示すように、参照変形体16の側面に文字からなるID40が付与されている。ID40は、例えば、4つのアルファベットからなる"BBAC"というIDである。参照変形体16の側面(被検体との接触面以外)にID40を付与したのは、被検体に送受信する超音波に影響しないようにするためである。操作者は、参照変形体16の側面のID40を見るにより、アルファベットの並びすなわちID40を識別することができる。なお、ID40は、数字、記号、図形、色等でもよい。

【0 0 3 7】

また、図3(b)に示すように、参照変形体16を成型する金型に予めID40を刻印するための凹凸を設けておき、金型に参照変形体16のゲル材料を流し込むことにより、参照変形体16の側面に凹凸からなるID40を形成することができる。操作者は、参照変形体16の側面に形成されたID40の凹凸を見たり、触れたりすることによりID40を識別することができる。なお、参照変形体16の側面には、例えば、ノコギリ形状や波形状等を加工する等、表面加工を施してもよい。

10

【0 0 3 8】

また、参照変形体16を染色することにより色でID40を識別できるようになっていてよい。例えば、参照変形体16が白色なら、ID40は"BBAC"であり、参照変形体16が黄色なら、ID40は"AAAA"であるとする。

【0 0 3 9】**(1 2 : パッケージにID)**

20

また、図3(c)に示すように、参照変形体16をパッケージするケース42にID40を付与されておいてもよい。ケース42は、内部に空隙がある器部46と蓋部44を有しており、参照変形体16は、器部46と蓋部44の間に密封して収められている。参照変形体16をケース42内に密封して収めることにより、埃や空気等の進入を防ぐことができるため、参照変形体16の劣化を最小限に抑えることができる。

操作者は、参照変形体16をパッケージするケース42のID40を見ることにより、アルファベットの並びすなわち参照変形体16のID40を識別することができる。

【0 0 4 0】**(1 3 : ID手入力)**

30

次に図4に示すように、操作者は、参照変形体16のID40、若しくは参照変形体16をパッケージするケース42に記載されたID40を入力部34に入力する。制御部32は入力部34にて入力されたID40を参照変形体情報取得部30に出力させ、参照変形体16の種類を特定するよう指令を与える。そして、参照変形体情報取得部30は、出力されたID40から参照変形体16の種類を特定し、参照変形体16の種類を圧力演算部15と弾性率演算部10の演算に反映させる。また、参照変形体情報取得部30は、参照変形体16の種類を画像表示器14に表示する。

【0 0 4 1】

具体的には、参照変形体情報取得部30は、入力された参照変形体16のID40を受信するID情報受信部50と、予め複数の参照変形体16のID40と参照変形体16の種類の関係を記憶したメモリ52と、メモリ52に記憶された情報に基づいて、入力されたID40に対応した参照変形体16の種類を特定する種類特定部54とからなる。また、メモリ52には、下記表1に示すように、1つのID40に対して、1つの参照変形体16の種類(厚さ、弾性特性、音響特性、探触子の種類等)が対応して記憶されている。

40

【0 0 4 2】

【表1】

ID	厚さ (mm)	弾性特性 (N/m)	音響特性 (N・s/m ³)	探触子の種類 (適用部位)
AAAA	8	100	1.5×10^6	リニア型
BAAA	7	100	1.5×10^6	リニア型
BBAA	7	50	1.5×10^6	リニア型
・	・	・	・	・
・	・	・	・	・
DDDD	5	30	1.0×10^6	体腔内型

【0043】

ここで、参照変形体16の厚さとは、参照変形体16の超音波送受信方向の厚さであり、圧迫前における初期の厚さである。弾性特性とは、参照変形体16の弾性率、粘弾性率、非線形性、ポアソン比等を示す特性である。本実施形態では、弾性特性を弾性率とする。また、音響特性とは、参照変形体16の音速、減衰率、音響インピーダンス等を示す特性である。本実施形態では、音響特性を音響インピーダンスとする。探触子の種類とは、参照変形体16を装着する超音波探触子3の種類である。例えば、被検体の体外から圧迫するリニア型の超音波探触子3、コンベックス型の超音波探触子3等や、被検体の体内から圧迫する体腔内型の超音波探触子3等があり、適用部位が定められる。

20

【0044】

ID40を示す4つのアルファベットは、それぞれの参照変形体16の種類にそれぞれ対応している。左端のアルファベットは、参照変形体16の厚さに対応している。例えば、左端のアルファベットがAなら8mm、Bなら7mm、Cなら6mm、Dなら5mmとなっている。そのため、操作者はID40を見るだけで、参照変形体16はどれくらいの厚さかを認識することができる。同様にして、左から2番目のアルファベットは、参照変形体16の弾性特性に対応している。左から3番目のアルファベットは、参照変形体16の音響特性に対応している。右端のアルファベットは、参照変形体16を装着する超音波探触子3の種類に対応している。

【0045】

そして、種類特定部54は、入力されたID40に対応した参照変形体16の種類をメモリ52から読み出して特定する。なお、入力部34は、ID40ではなく、参照変形体16の特性の情報(例えば、参照変形体16の弾性特性等)を入力することができるようになっていてもよい。

30

【0046】

(14：圧力計測)

種類特定部54は、参照変形体16の種類を圧力演算部15に出力する。圧力演算部15は、参照変形体情報取得部30から出力される参照変形体16の種類(厚さ、弾性特性、音響特性、探触子の種類等)のうち特に厚さと弾性率を検出する。この検出される厚さは、被検体を圧迫していない参照変形体16の初期の厚さである。

【0047】

圧力演算部15は、RF信号フレームデータ選択部8から出力されるRF信号フレームデータから、被検体を圧迫することによって変形した参照変形体16の歪みを求める。具体的には、圧力演算部15は、まず、被検体と参照変形体16の境界を含む領域のRF信号フレームデータを抽出する。そして、圧力演算部15は、このRF信号フレームデータに基づいて被検体と参照変形体16の境界の座標を求める。例えば、境界を含むRF信号フレームデータの信号波形の振幅に対して閾値を設け、深度方向の原点0(振動子と参照変形体16の接触面)とし、そこから深度方向へRF信号フレームデータの波形の振幅が初めて閾値を超えた座標が、境界の座標として検出される。

40

【0048】

上記では、RF信号フレームデータに基づいて、被検体と参照変形体16の境界を検出したが、白黒スキャンコンバータ16から出力される断層画像データを用いて境界を検出しても

50

よい。図5(a)には、被検体を圧迫する前の参照変形体16の状態を示す。図5(b)に被検体を圧迫した後の参照変形体16の状態を示す。圧力演算部15は、断層画像データにおいて、組織1と参照変形体16の音響特性(音速、減衰率、音響インピーダンス)の違いに基づいて、その境界の座標を検出する。

【0049】

そして、圧力演算部15は、圧迫前における参照変形体16の初期の厚さに対応する境界の座標を関連付ける。また、圧力演算部15は、初期の厚さに対応する境界の座標を関連に基づいて、圧迫後における境界の座標から参照変形体16の変位を算出する。そして、圧力演算部15は、算出された変位と初期の厚さから歪みを算出する。

【0050】

また、参照変形体16の弾性率(弾性特性の一部)は、ID40に基づいて、種類特定部54で特定されている。ここで、P(圧力(応力))、Y(弾性率)、d(歪み)とすると、次式の関係が成り立つ。

【0051】

【数2】

$$P(\text{圧力(応力)}) = Y(\text{弾性率}) \times \delta d(\text{歪み})$$

圧力演算部15は、上記数2に基づいて、被検体と参照変形体16の境界における圧力を求めることができる。

(15: 弹性率演算)

弾性率演算部10は、変位・歪み演算部9から出力される歪み情報と圧力演算部15から出力される圧力情報から、上記数1に基づいて弾性率を演算して、弾性率の数値データ(弾性フレームデータ)を生成する。弾性率演算部10は、弾性データ処理部11に弾性フレームデータを出力する。

【0052】

カラースキャンコンバータ12は、弾性データ処理部11から出力される弾性フレームデータに色相情報を付与し、画像表示器14は、カラースキャンコンバータによって得られた弾性画像データに基づく弾性画像を表示する。なお、図示はしないが、画像表示器14は弾性率演算部10から出力される弾性率を数値で表示してもよい。

【0053】

以上、本実施形態によれば、参照変形体16の種類をID40から認識することにより、その情報を弾性演算に反映させることができる。そのため、安定して弾性演算を行なうことができる。

【0054】

(16: ID表示)

また、種類特定部54は、参照変形体16の種類やID40をシネメモリ36に出力する。シネメモリ36は、弾性画像や断層画像とともに参照変形体16の種類やID40の情報を記憶する。画像表示器14は、シネメモリ36から参照変形体16の種類やID40の情報を弾性画像や断層画像とともに出力して、表示する。つまり、参照変形体の種類やID40を表示することができる。

【0055】

操作者は、参照変形体16の種類やID40を把握できるため、超音波の設定を行なうことができる。また、超音波診断後に参照変形体16を適用して取得した弾性画像や断層画像をレビューした際、どの種類の参照変形体16を利用して取得した弾性画像や断層画像であるのかを認識できる。

【0056】

また、ID40には、表1の通り、専用の超音波探触子3の情報が付与されている。図示はしないが、参照変形体16が専用の超音波探触子3以外に対して適用され、超音波を送受信した場合、参照変形体情報取得部30は画面表示器14に警告を表示したり、音声を発せさせたりすることもできる。

10

20

30

40

50

【0057】

(第2の実施形態：ID自動認識)

(21：エコー輝度)

ここで第2の実施形態について図6～図9を用いて説明する。第1の実施形態と異なる点は、参照変形体16のID40を自動認識する点である。

参照変形体情報取得部30は、シネメモリ36に記憶された断層画像を解析する画像解析部60と、予め複数の参照変形体16のID40と参照変形体16の断層画像の特徴量との関係を記憶したメモリ52と、メモリ52に記憶された情報に基づいて、入力された断層画像に対応した参照変形体16の種類を特定する種類特定部54とからなる。

【0058】

参照変形体16は、例えば、散乱体を含有している。画像解析部60は、シネメモリ36から出力される散乱体が含有された参照変形体16の断層画像のエコー輝度を解析する。そして、メモリ52は、参照変形体16のエコー輝度(0～255)をID40に関連付けて複数記憶する。例えば、表2に示すように、弾性率や散乱体濃度等が異なる2種類(ID40： α 、 β)の参照変形体16があり、メモリ52に記憶されているとする。なお、それぞれの参照変形体16に同じ条件の超音波が送受信されているものとする。

10

【0059】

【表2】

ID	弾性率(kPa)	散乱体濃度(%)	エコー輝度 (0～255)	厚さ (mm)
α	10	1	50	8
β	20	3	100	7

【0060】

図7は、散乱体が含有された参照変形体16(α 、 β)を装着した場合の断層画像である。図7(a)はID40が α の参照変形体16を装着した場合の断層画像であり、図7(b)はID40が β の参照変形体16を装着した場合の断層画像である。

【0061】

断層画像の深度が浅い領域(例えば0～5mm)に参照変形体16のエコー輝度が表示される。画像解析部60は、シネメモリ36に記憶された断層画像の浅い領域のエコー輝度を解析する。例えば、画像解析部60は、断層画像の参照変形体16にROI70を設定し、そのROI70内の輝度情報を解析する。このROI70は、入力部34を介して任意に設定される。また、断層画像の深度が浅い領域(例えば0～5mm)にROI70が自動で設定されるようになっていてもよい。

30

【0062】

画像解析部60は、ROI70内のエコー輝度の平均値や分散値等のエコー輝度の統計的な特徴を解析する。そして、種類特定部54は、解析された断層画像のエコー輝度の特徴に対応した参照変形体16の種類をメモリ52から読み出して特定する。

【0063】

具体的には、種類特定部54は、ROI70内のエコー輝度の平均値が"50"であれば、ID40が α の参照変形体であると特定する。また、種類特定部54は、ROI70内のエコー輝度の平均値が"100"であれば、ID40が β の参照変形体であると特定する。

40

【0064】

そして、種類特定部54は、参照変形体16の種類(ここでは、弾性率、散乱体濃度、エコー輝度、厚さ)やID40をシネメモリ36に出力する。シネメモリ36は、弾性画像や断層画像とともに参照変形体16の種類やID40の情報を記憶する。画像表示器14は、シネメモリ36から参照変形体16の種類やID40の情報を弾性画像や断層画像とともに出力して、表示する。よって、操作者は、参照変形体16の種類やID40を把握できるため、超音波の設定を行なうことができる。また、どの種類の参照変形体16を利用して取得した弾性画像や断層画像であるのかを認識できる。

50

【0065】

また、第1の実施形態と同様にして、参照変形体16の種類に基づいて弾性率を演算もよい。種類特定部54は、参照変形体16の種類を圧力演算部15に出力して、圧力演算部15は、圧力を演算する。そして、弾性率演算部10は、変位・歪み演算部9から出力される歪み情報と圧力演算部15から出力される圧力情報から弾性率を演算して、弾性率の数値データ(弾性フレームデータ)を生成する。弾性フレームデータに基づいて、画像表示器14は、弾性画像や弾性率を表示する。

【0066】**(22: 減衰特性)**

上記では、種類特定部54は、参照変形体16のエコー輝度の平均値から参照変形体16の種類を特定したが、例えば、参照変形体16の散乱体の濃度が大きく異なっても、ROI70内は、ほぼ平均的なエコー輝度が分布する場合がある。10

【0067】

そこで、種類特定部54は、参照変形体16の減衰特性から参照変形体16の種類を特定してもよい。この減衰特性は散乱体の濃度に比例して超音波が減衰するという特性である。画像解析部60は、参照変形体15のエコー輝度の強度の分布から減衰特性を解析する。なお、参照変形体16内のエコー輝度の強度は、深度が浅い箇所から深い箇所に行くにつれて減衰する特性を持っている。

【0068】

低い送信電圧での超音波を超音波探触子3から送受信し、参照変形体16の散乱体の濃度が高いときは、減衰率が大きく、エコー輝度の強度が急激に減衰する。この参照変形体16のID40を 20 とする。また、低い送信電圧での超音波を超音波探触子3から送受信し、参照変形体16の散乱体の濃度が低いときは、減衰率が小さく、エコー輝度の強度が緩やかに減衰する。この参照変形体16のID40を とする。この参照変形体16の減衰とID40の関係をメモリ52に記憶させておく。

【0069】

画像解析部60は、ROI70内のエコー輝度から散乱体のエコー輝度の強度の分布から減衰率を解析する。そして、種類特定部54は、減衰率に対応した参照変形体16の種類をメモリ52から読み出して特定する。種類特定部54は、ROI70内の減衰率が高い場合、ID40が 30 の参照変形体16であると特定する。種類特定部54は、ROI70内の減衰率が低い場合、ID40が の参照変形体16であると特定する。

【0070】**(23: 散乱体のパターン)**

また、種類特定部54は、参照変形体16の散乱体の密度分布(疎密度)から参照変形体16の種類を特定してもよい。

例えば、参照変形体16の散乱体の密度分布が浅い部位から深い部位にいくにつれて高くなる場合、参照変形体16のID40を とする。参照変形体16の散乱体の密度分布が浅い部位から深い部位にいくにつれて低くなる場合、参照変形体16のID40を とする。この参照変形体16の散乱体分布とID40の関係をメモリ52に記憶させておく。

【0071】

画像解析部60は、ROI70内のエコー輝度から散乱体の密度分布を解析する。そして、種類特定部54は、解析された散乱体の密度分布に対応した参照変形体16の種類をメモリ52から読み出して特定する。40

【0072】

種類特定部54は、ROI70内のエコー輝度が浅い部位から深い部位にいくにつれて低くなる場合、ID40が の参照変形体16であると特定する。種類特定部54は、ROI70内のエコー輝度が浅い部位から深い部位にいくにつれて高くなる場合、ID40が の参照変形体16であると特定する。なお、種類特定部54は、参照変形体16の散乱体のエコー輝度の分布の離散性(正規分布の分散)に基づいて、参照変形体16の種類を特定してもよい。

【0073】

10

20

30

40

50

(24: 散乱体の大きさ、形状)

また、変形体種類特定部54は、散乱体の大きさから参照変形体16の種類を特定してもよい。例えば、参照変形体16に含まれる散乱体の大きさが $5\mu m$ である場合、参照変形体16のID40を とする。参照変形体16に含まれる散乱体の大きさが $10\mu m$ である場合、参照変形体16のID40を とする。なお、参照変形体16には、複数の散乱体が均一な大きさで含有されているものとする。この参照変形体16の散乱体の大きさとID40の関係をメモリ52に記憶させておく。

【0074】

画像解析部60は、ROI70内のエコー輝度から散乱体の大きさを解析する。そして、種類特定部54は、解析された散乱体の大きさ($5\mu m$ or $10\mu m$)に対応した参照変形体16の種類をメモリ52から読み出して特定する。なお、変形体種類特定部54は、パターンマッチング法によって参照変形体16の散乱体の形状を識別することも可能である。ID40毎に散乱体の形状が異なるように参照変形体16が設定されている。10

【0075】

参照変形体16の散乱体の形状とID40の関係をメモリ52に記憶させておく。画像解析部60は、ROI70内のエコー輝度から散乱体の形状を解析する。そして、種類特定部54は、メモリ52に記憶されている散乱体の形状と、解析された散乱体の形状との間でパターンマッチングを行なう。種類特定部54は、メモリ52に記憶されている最もマッチングが取れた散乱体を含む参照変形体16の種類を読み出して特定する。20

【0076】

(25: 層、バーコード)

また、変形体種類特定部54は、参照変形体16の形態やバーコード等によって種類を特定してもよい。図8に示すように、参照変形体16は、種類が異なる複数の層(層1、層2)からなっているものとする。なお、層1は超音波探触子3側であり、層2は被検体側である。図8(a)に示すように、参照変形体16が(層1：層2 = 1 : 2)の場合、参照変形体16のID40を とする。図8(b)に示すように、参照変形体16が(層1：層2 = 1 : 1)の場合、参照変形体16のID40を とする。この参照変形体16の層の比とID40の関係をメモリ52に記憶させておく。30

【0077】

画像解析部60は、弾性画像のエコー輝度から参照変形体16の層1と層2の比を解析する。具体的には、画像解析部60は、エコー輝度に基づいて、層1と層2の境界を検出し、層2と組織1との境界を検出する。そして、画像解析部60は、それぞれの境界から深度方向における層1と層2の高さを検出する。そして、種類特定部54は、検出された層1と層2の比に対応した参照変形体16のID40をメモリ52から読み出して特定する。40

【0078】

また、図9に示すように、参照変形体16の側面にバーコードからなるマーク72が設けられているものとする。図9(a)に示すように、参照変形体16がバーコード1本含んでいる場合、参照変形体16のID40を とする。図9(b)に示すように、参照変形体16がバーコード2本含んでいる場合、参照変形体16のID40を とする。この参照変形体16のバーコードの本数とID40の関係をメモリ52に記憶させておく。なお、バーコードのマーク72は、参照変形体16のエコー輝度と異なるものとする。なお、バーコードの配列方向は、参照変形体16の長軸方向又は短軸方向である。40

【0079】

画像解析部60は、弾性画像のエコー輝度から参照変形体16のバーコードの本数を解析する。そして、種類特定部54は、解析されたバーコードの本数に対応した参照変形体16のID40をメモリ52から読み出して特定する。

【0080】

ここでは、マーク72をバーコードとしたが、凹部や切り欠きを利用してよい。また、参照変形体16の短軸方向に沿って、参照変形体16の内部に非常に細い紐(例えば釣り糸等)を張り、その本数や配置の間隔の情報を利用してもよい。

【0081】

(第3の実施形態：画像処理)

ここで第3の実施形態について図10、11を用いて説明する。第1の実施形態と第2の実施形態と異なる点は、参照変形体16の種類を認識して画像処理を行なう点である。

図10に示すように、参照変形体情報取得部30は、上述した画像解析部60とメモリ52と種類特定部54に加えて、シネメモリ36に記憶された断層画像(弹性画像でも可)について画像処理を行なう画像処理部62を有している。

【0082】

種類特定部54は、参照変形体16のID40(厚さ、弹性特性、音響特性、探触子の種類等を含む)を画像処理部62に出力する。画像処理部62は、ID40のうち厚さを検出する。

10

【0083】

画像処理部62は、図11に示すように、参照変形体16が表示されないように、参照変形体16の"厚さ"に応じて、断層画像を上方向(超音波探触子3側)にシフトする。図11(a)は補正前の断層画像であり、図11(b)は補正後の断層画像である。

【0084】

具体的には、表1のように、種類特定部54で特定されるID40がAAAAなら参照変形体16の厚さは8mmである。画像処理部62は、種類特定部54から参照変形体の厚さ情報を取り込んで、シネメモリ36に記憶されている断層画像を8mm上方向にシフトする。ID40がBAAAなら参照変形体16の厚さは7mmである。画像処理部62は、種類特定部54から参照変形体の厚さ情報を取り込んで、シネメモリ36に記憶されている断層画像を7mm上方向にシフトする。よって、図11(b)に示すように、参照変形体16が画像表示器14に表示されないため、深部における組織5の表示領域を広げることができる。

20

【0085】

(第4の実施形態：厚さ分だけフォーカス)

ここで第4の実施形態について説明する。第1の実施形態～第3の実施形態と異なる点は、参照変形体16のID40を認識して超音波送受信を制御する点である。

【0086】

本実施形態では、図示はしないが、参照変形体情報取得部30と超音波送受信制御回路1と接続されている。

【0087】

種類特定部54は、参照変形体16のID40(厚さ、弹性特性、音響特性、探触子の種類等を含む)を超音波送受信制御回路1に出力する。超音波送受信制御回路1は、ID40のうち"厚さ"を検出する。そして、超音波送受信制御回路1は、厚さに応じて、参照変形体16にフォーカスされないように、超音波のフォーカスを制御する。

30

【0088】

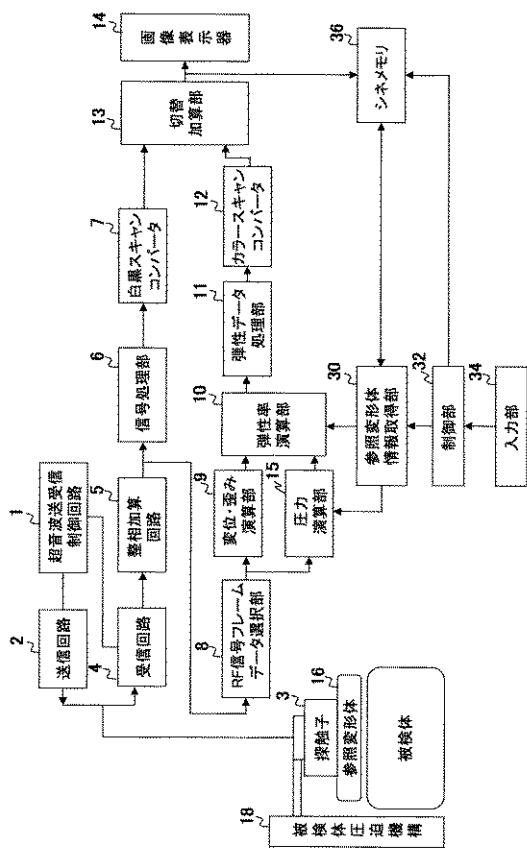
具体的には、表1のように、種類特定部54で特定されるID40がAAAAなら参照変形体16の厚さは8mmである。超音波送受信回路1は、種類特定部54から参照変形体の厚さ情報を取り込んで、参照変形体16にフォーカスされないように、8mmより深い深度に超音波がフォーカスされるように送信回路2と受信回路4の制御を行なう。

【0089】

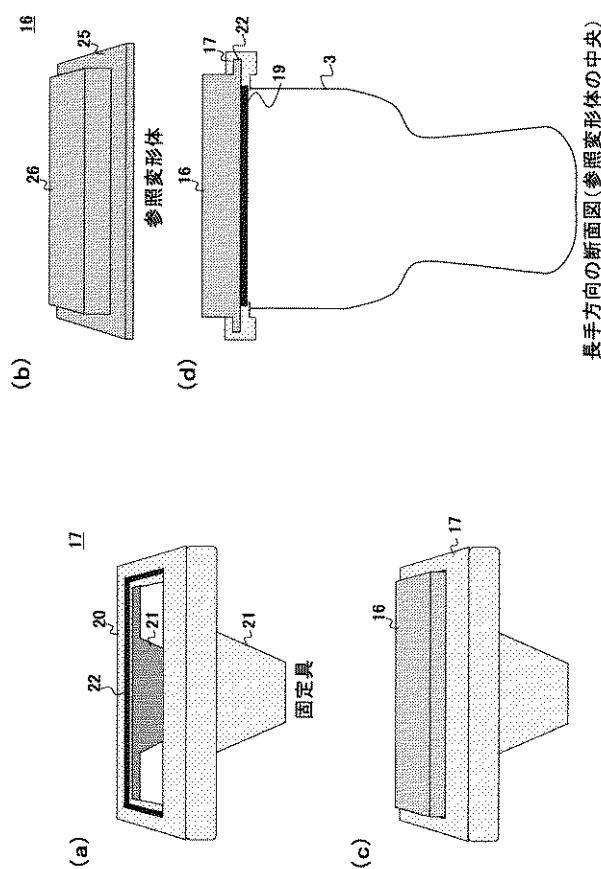
よって、被検体の組織1～5に超音波がフォーカスされるため、画像表示器14は適切に断層画像を表示することができる。

40

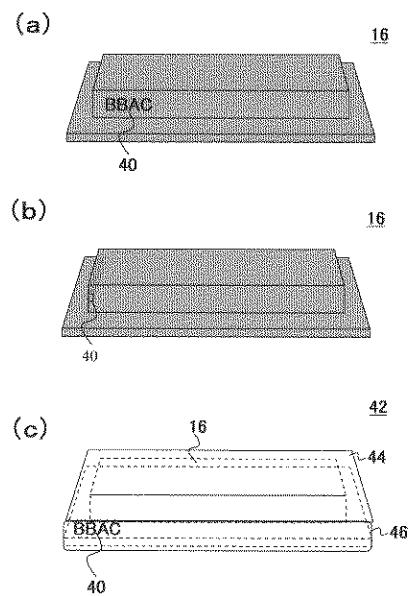
【図1】



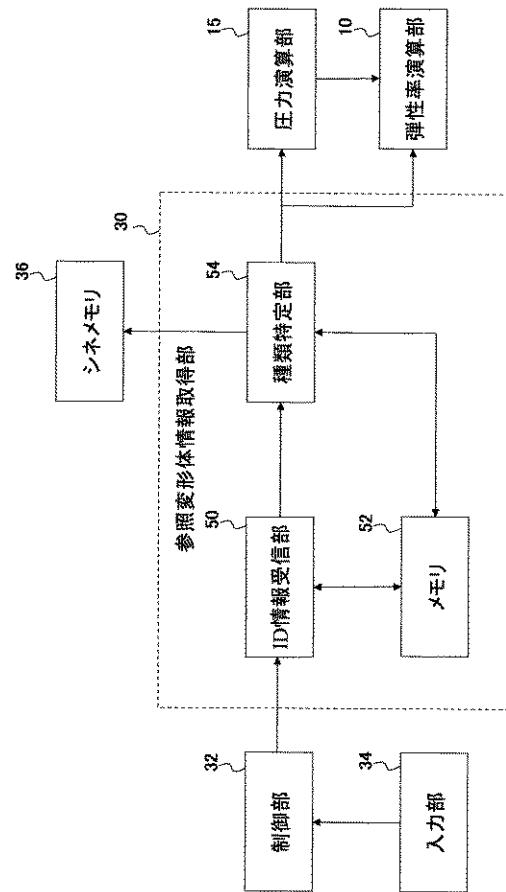
【図2】



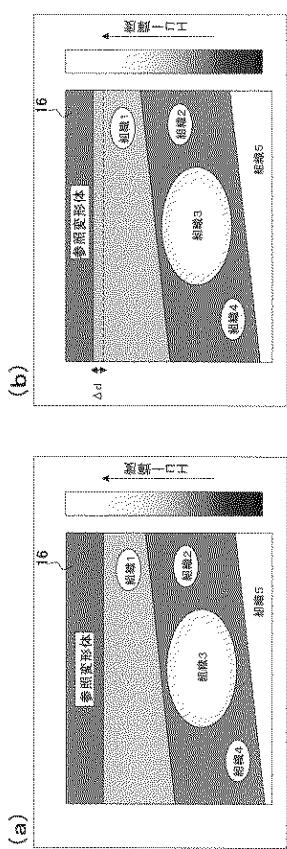
【図3】



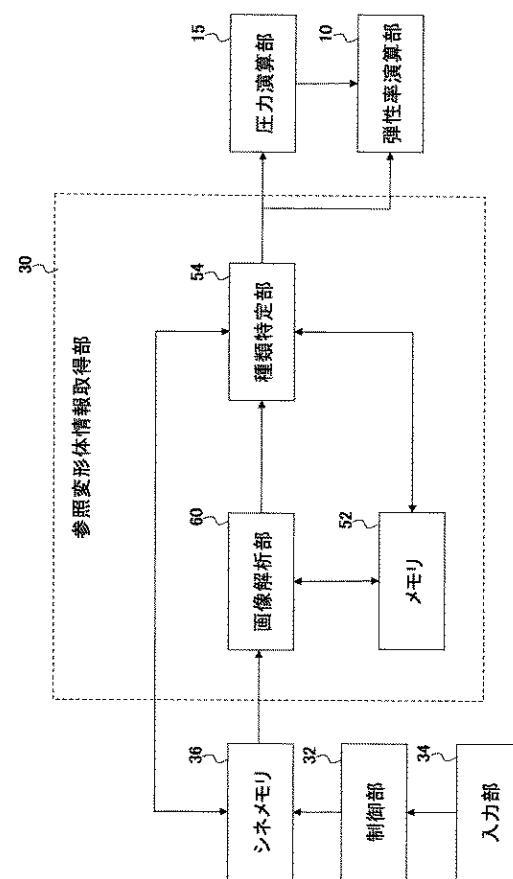
【図4】



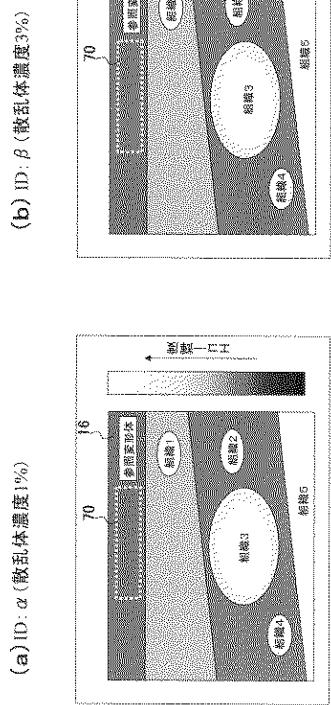
【図5】



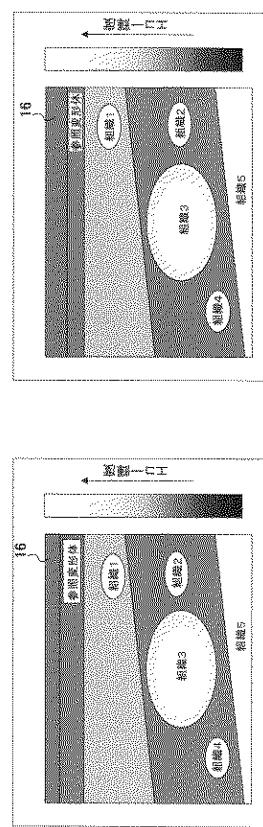
【図6】



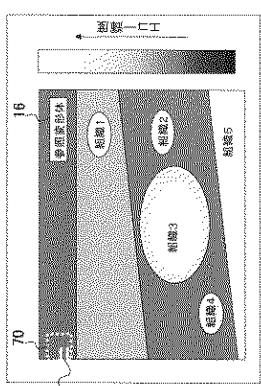
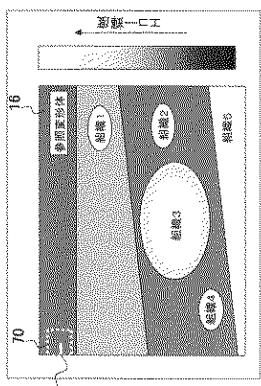
【図7】



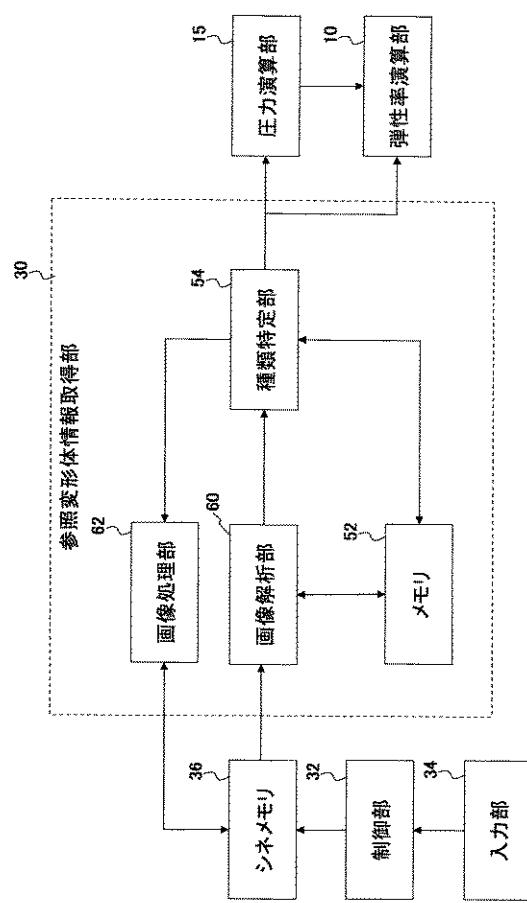
【図8】



【図 9】

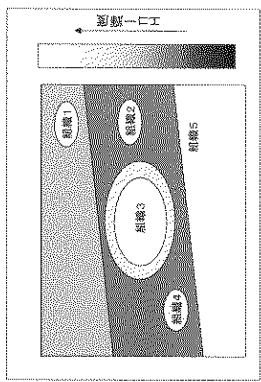
(b) ID: β (八—二—二本)(a) ID: α (八—二—一本)

【図 10】

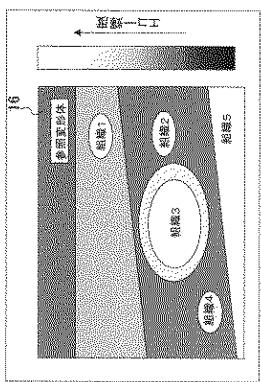


【図 11】

(a) 补正前



(b) 补正後



【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/JP2009/057469
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER A61B8/08 (2006.01)i		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) A61B8/08		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2009 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2009 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2009		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	WO 2005/120358 A1 (Hitachi Medical Corp.), 22 December, 2005 (22.12.05), Par. Nos. [0052], [0060] & EP 1762180 A1 & US 2008/0269606 A1	1-8, 11-13, 15 9, 10
Y A	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 86486/1989 (Laid-open No. 27214/1991) (Yokogawa Medeikaru Shisutemu Kabushiki Kaisha), 19 March, 1991 (19.03.91), Fig. 1 (Family: none)	1-8, 11-13, 15 9, 10
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
<p>* Special categories of cited documents:</p> <p>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</p> <p>"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date</p> <p>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</p> <p>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</p> <p>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</p> <p>"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention</p> <p>"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone</p> <p>"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art</p> <p>"&" document member of the same patent family</p>		
Date of the actual completion of the international search 18 May, 2009 (18.05.09)	Date of mailing of the international search report 16 June, 2009 (16.06.09)	
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile No.	Telephone No.	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/057469

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2007-236823 A (Toshiba Corp., Toshiba Medical Systems Corp.), 20 September, 2007 (20.09.07), Par. Nos. [0068], [0069] & US 2007/0239006 A1 & CN 101032411 A	8,11
Y	JP 7-178089 A (Toshiba Corp.), 18 July, 1995 (18.07.95), Par. Nos. [0042] to [0045] & DE 4444793 A1	12,13
Y	JP 2005-66041 A (Hitachi Medical Corp.), 17 March, 2005 (17.03.05), Par. No. [0033] (Family: none)	1-8,11-13,15
Y	JP 2007-215672 A (Toshiba Corp., Toshiba Medical Systems Corp., Toshiba Medical Systems Engineering Co., Ltd.), 30 August, 2007 (30.08.07), Full text; all drawings (Family: none)	1-7,15
Y	JP 6-154215 A (Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.), 03 June, 1994 (03.06.94), Full text; all drawings (Family: none)	1-7,15
Y	JP 2007-14485 A (Fujifilm Holdings Corp., Fujinon Corp.), 25 January, 2007 (25.01.07), Full text; all drawings (Family: none)	1-7,15
Y	JP 5-76528 A (Hitachi Medical Corp.), 30 March, 1993 (30.03.93), Full text; all drawings (Family: none)	1-7,15
Y	JP 2003-70788 A (Hitachi Medical Corp.), 11 March, 2003 (11.03.03), Full text; all drawings (Family: none)	1-7,15

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/057469

Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. Claims Nos.: 14
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
Claim 14 is relevant to methods for treatment of the human body by surgery or therapy and for diagnosis of the same and thus relates to a subject matter which this International Searching Authority is not required, under the
(Continued to extra sheet)
2. Claims Nos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3. Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2. As all searchable claims could be searched without effort justifying additional fees, this Authority did not invite payment of additional fees.
3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:.
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:.

Remark on Protest
the

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest and, where applicable, payment of a protest fee.
- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest but the applicable protest fee was not paid within the time limit specified in the invitation.
- No protest accompanied the payment of additional search fees**

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2009/057469

Continuation of Box No.II-1 of continuation of first sheet (2)

provisions of Article 17(2)(a)(i) of the PCT and Rule 39.1(iv) of the Regulations under the PCT, to search.

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2009/057469										
<p>A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. A61B8/08(2006.01)i</p>												
<p>B. 調査を行った分野 調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC）） Int.Cl. A61B8/08</p>												
<p>最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの</p> <table> <tr><td>日本国実用新案公報</td><td>1922-1996年</td></tr> <tr><td>日本国公開実用新案公報</td><td>1971-2009年</td></tr> <tr><td>日本国実用新案登録公報</td><td>1996-2009年</td></tr> <tr><td>日本国登録実用新案公報</td><td>1994-2009年</td></tr> </table>				日本国実用新案公報	1922-1996年	日本国公開実用新案公報	1971-2009年	日本国実用新案登録公報	1996-2009年	日本国登録実用新案公報	1994-2009年	
日本国実用新案公報	1922-1996年											
日本国公開実用新案公報	1971-2009年											
日本国実用新案登録公報	1996-2009年											
日本国登録実用新案公報	1994-2009年											
<p>国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）</p>												
<p>C. 関連すると認められる文献</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>引用文献の カテゴリー*</th> <th>引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示</th> <th>関連する 請求項の番号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Y A</td> <td>WO 2005/120358 A1 (株式会社日立メディコ) 2005.12.22, 段落 [0052]、[0060] & EP 1762180 A1 & US 2008/0269606 A1</td> <td>1-8, 11-13, 15 9, 10</td> </tr> <tr> <td>Y A</td> <td>日本国実用新案登録出願 1-86486 号(日本国実用新案登録出願公開 3-27214 号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイ クロフィルム(横河メディカルシステム株式会社) 1991.03.19, 図1(ファミリーなし)</td> <td>1-8, 11-13, 15 9, 10</td> </tr> </tbody> </table>				引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号	Y A	WO 2005/120358 A1 (株式会社日立メディコ) 2005.12.22, 段落 [0052]、[0060] & EP 1762180 A1 & US 2008/0269606 A1	1-8, 11-13, 15 9, 10	Y A	日本国実用新案登録出願 1-86486 号(日本国実用新案登録出願公開 3-27214 号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイ クロフィルム(横河メディカルシステム株式会社) 1991.03.19, 図1(ファミリーなし)	1-8, 11-13, 15 9, 10
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号										
Y A	WO 2005/120358 A1 (株式会社日立メディコ) 2005.12.22, 段落 [0052]、[0060] & EP 1762180 A1 & US 2008/0269606 A1	1-8, 11-13, 15 9, 10										
Y A	日本国実用新案登録出願 1-86486 号(日本国実用新案登録出願公開 3-27214 号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を撮影したマイ クロフィルム(横河メディカルシステム株式会社) 1991.03.19, 図1(ファミリーなし)	1-8, 11-13, 15 9, 10										
<input checked="" type="checkbox"/> ○欄の続きにも文献が列挙されている。		<input type="checkbox"/> パテントファミリーに関する別紙を参照。										
<p>* 引用文献のカテゴリー 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用す る文献(理由を付す) 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願</p> <p>の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリー文献</p>												
国際調査を完了した日 18. 05. 2009		国際調査報告の発送日 16. 06. 2009										
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号		特許庁審査官(権限のある職員) 川上 則明	2Q 3704									
		電話番号 03-3581-1101 内線 3292										

国際調査報告		国際出願番号 PCT/JP2009/057469
C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2007-236823 A (株式会社東芝、東芝メディカルシステムズ株式会社) 2007.09.20, 段落 [0068], [0069] & US 2007/0239006 A1 & CN 101032411 A	8, 11
Y	JP 7-178089 A (株式会社東芝) 1995.07.18, 段落 [0042] - [0045] & DE 4444793 A1	12, 13
Y	JP 2005-66041 A (株式会社日立メディコ) 2005.03.17, 段落 [0033] (ファミリーなし)	1-8, 11-13, 15
Y	JP 2007-215672 A (株式会社東芝、東芝メディカルシステムズ株式会社、東芝医用システムエンジニアリング株式会社) 2007.08.30, 全文、全図 (ファミリーなし)	1-7, 15
Y	JP 6-154215 A (松下電器産業株式会社) 1994.06.03, 全文、全図 (ファミリーなし)	1-7, 15
Y	JP 2007-14485 A (富士フィルムホールディングス株式会社、フジノン株式会社) 2007.01.25, 全文、全図 (ファミリーなし)	1-7, 15
Y	JP 5-76528 A (株式会社日立メディコ) 1993.03.30, 全文、全図 (ファミリーなし)	1-7, 15
Y	JP 2003-70788 A (株式会社日立メディコ) 2003.03.11, 全文、全図 (ファミリーなし)	1-7, 15

国際調査報告	国際出願番号 PCT/JP2009/057469
第II欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見（第1ページの2の続き）	
法第8条第3項（PCT17条(2)(a)）の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。	
1. <input checked="" type="checkbox"/> 請求項 <u>14</u> は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、 請求項14は、人の身体の手術又は治療による処理及び診断方法に該当し、PCT第17条(2)(a)(i)及びPCT規則39.1(iv)の規則により、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。	
2. <input type="checkbox"/> 請求項 _____ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、	
3. <input type="checkbox"/> 請求項 _____ は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に従って記載されていない。	
第III欄 発明の単一性が欠如しているときの意見（第1ページの3の続き）	
次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。	
1. <input type="checkbox"/> 出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求項について作成した。	
2. <input type="checkbox"/> 追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求項について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかつた。	
3. <input type="checkbox"/> 出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかつたので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求項のみについて作成した。	
4. <input type="checkbox"/> 出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかつたので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求項について作成した。	
追加調査手数料の異議の申立てに関する注意	
<input type="checkbox"/> 追加調査手数料及び、該当する場合には、異議申立手数料の納付と共に、出願人から異議申立てがあつた。 <input type="checkbox"/> 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあつたが、異議申立手数料が納付命令書に示した期間内に支払われなかつた。 <input type="checkbox"/> 追加調査手数料の納付はあつたが、異議申立てはなかつた。	

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW,GH,GM,KE,LS,MW,MZ,NA,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM),EP(AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,SE,SI,S,K,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,K,E,KG,KM,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PG,PH,PL,PT,RO,RS,RU,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,VC,VN,ZA,ZM,ZW

(注)この公表は、国際事務局（WIPO）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第184条の10第1項（実用新案法第48条の13第2項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

专利名称(译)	参考变型，超声诊断设备和超声诊断方法		
公开(公告)号	JPWO2009131027A1	公开(公告)日	2011-08-18
申请号	JP2010509143	申请日	2009-04-14
[标]申请(专利权)人(译)	株式会社日立医药		
申请(专利权)人(译)	株式会社日立メディコ		
[标]发明人	松村剛		
发明人	松村 剛		
IPC分类号	A61B8/08		
CPC分类号	A61B8/00 A61B8/4281 A61B8/4438 A61B8/4455 A61B8/485		
FI分类号	A61B8/08		
F-TERM分类号	4C601/BB02 4C601/DD19 4C601/DD23 4C601/GC03 4C601/GC04 4C601/HH29 4C601/JB36 4C601/JB48 4C601/KK07 4C601/KK12 4C601/KK34		
优先权	2008114869 2008-04-25 JP		
其他公开文献	JP5394372B2 JPWO2009131027A5		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

提供可以指定类型的参考可变形体，指定参考可变形体的类型的超声诊断设备和超声诊断方法。根据被检体的断层摄影区域的RF信号帧数据，将基准可变形体16安装于超声波发送接收面的超声波探头3经由基准可变形体16向被检体发送超声波/从被检体接收超声波。在包括用于生成断层图像的断层图像形成单元6和7以及用于显示断层图像的显示单元14的超声诊断设备中，给予基准可变形体16的ID和基准可变形体16的类型。通过从存储单元52读取存储关系的参考变形体16的类型来识别参考变形体的类型的类型，该存储单元52存储与关系和参考变形体16的类型相对应的参考变形体16的ID，该参考变形体16的ID与附接到超声探头3上的ID。一种超声诊断设备，包括：识别单元54。